## 1 Statystyka opisowa

Niech  ${m x}=(x_1,\ldots,x_n)'$  będzie próbką, tzn.  $x_1,\ldots,x_n$  są obserwacjami zmiennej (cechy) X .

Zadaniem **statystyki opisowej** jest prezentacja rozkładu cechy X w próbce (rozkładu empirycznego), przy pomocy tabeli lub wykresu. Często wystarczające jest jedynie podanie kilku liczb charakteryzujących ten rozkład.

## Metody opisu rozkładu empirycznego:

- 1. tabelaryczny,
- 2. graficzny,
- 3. Statystyki opisowe
- klasyczne bazujące na uśrednianiu obserwowanych wartości w próbce, np. moment zwykły rzędu r:

$$m_r = rac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k^r$$

• pozycyjne - bazujące na posortowanych rosnąco wartościach w próbce, np. dolny kwartyl:

$$Q_1 = rac{1}{2}(x_{(i)} + x_{(j)}),$$

gdzie

$$i = \lceil rac{n+1}{4} 
ceil, \ j = \lceil rac{n}{4} 
ceil$$

lub górny kwartyl:

$$Q_3 = rac{1}{2}(x_{(i)} + x_{(j)}),$$

gdzie

$$i=\lceil rac{3(n+1)}{4}
ceil,\; j=\lceil rac{3n}{4}
ceil.$$

Charakterystyki tendencji centralnej rozkładu empirycznego:

1. średnia,

$$ar{x} = rac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k$$

2. mediana,

$$Me = \left\{ egin{aligned} x_{(rac{n+1}{2})}, & n ext{-- nieparzyste}, \ rac{1}{2}[x_{(rac{n}{2})} + x_{(rac{n}{2}+1)}], & n ext{-- parzyste}. \end{aligned} 
ight.$$

## Charakterystyki rozrzutu rozkładu empirycznego:

1. odchylenie standardowe,

$$s=\sqrt{rac{1}{n-1}\sum_{k=1}^n(x_k-ar{x})^2}$$

2. współczynnik zmienności

$$v = \frac{s}{\bar{x}} 100$$

## Funkcje związane ze statystyką opisową:

- 1. table szereg rozdzielczy (liczebności),
- 2. prop.table szereg rozdzielczy (proporcje, częstości),
- 3. cut dla cechy ilościowej ciągłej podział na przedziały klasowe,
- 4. barplot wykres słupkowy (cecha jakościowa lub ilościowa dyskretna),
- 5. pie wykres kołowy (cecha jakościowa lub ilościowa dyskretna),
- 6. hist histogram (cecha ilościowa ciągła).
- 7. mean średnia z próby,
- 8. median mediana z próby,
- 9. sd odchylenie standardowe z próby.